



微細表面形状の広範囲からの高速&高精度測定を実現する！

NEW

ワイドフィールド共焦点顕微鏡システム ZEISS Smartproof 5



広範囲 4mm²からナノの世界へ！

オーバービュー画像サイズは4mm×4mm。

簡単に測定位置を把握できます。

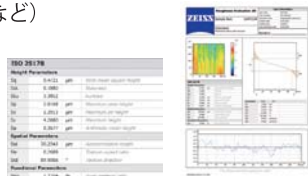
さらに内蔵ソフトウェアZEISS Efficient Navigation(ZEN)により、マクロ観察から細部の観察までのワークフローをシームレスにサポートします。



国際基準対応

粗さ解析はISO規格に準拠。

- ・粗さ（2次元）パラメーター：ISO 4287対応（距離、高さ、角度、半径、直径など）
 - ・粗さ（3次元）パラメーター：ISO 25178対応（横方向距離、3D距離、体積、面粗さなど）
- 定型フォームによる自動レポート作成。

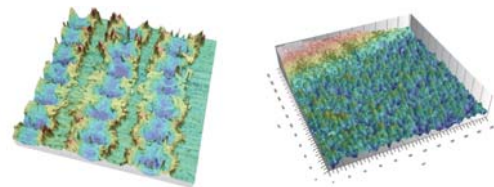


超高速&高精度測定を両立

400万画素（2048×2048pixel）の高速50fps面スキャンを実現。

レーザー顕微鏡の10倍以上の超高速撮影。（当社従来品との比較）

共焦点システムは光学系と駆動性能によりZ軸分解能1nm、XY分解能130nmを実現。



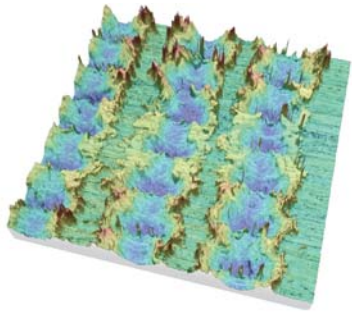
簡単&ローコスト

解析手順をフロー化し自動解析に対応。どなたでも簡単に解析できます。学習機能のある検査ジョブとワークフロー指向のグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）で繰り返し作業をガイドし、精密で再現性のあるデータ取得を誰でも簡単に行えます。取得データは自動的にソフトウェアに転送、3D特性を手間なく処理・解析。しかも従来機種約2/3のローコスト。

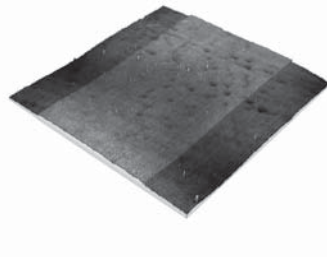
無料解析キャンペーン実施中 先着10名様！
レーザー顕微鏡を凌駕する高速撮影をご体感ください！



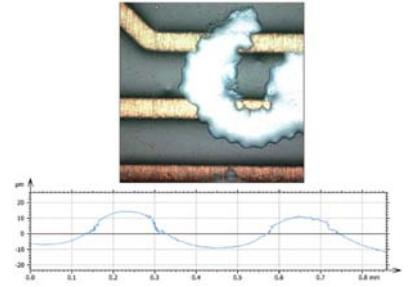
測定事例



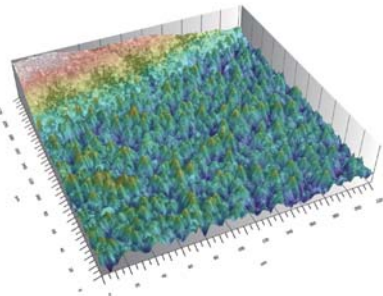
レーザー構造化表面、カラーコード化した高さマップにテクスチャを重ね合わせた3D画像
C Epiplan-Apochromat 50×/0.95



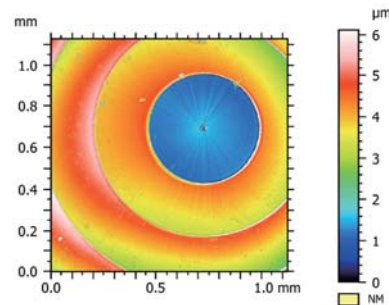
8nm 間隔の高さ基準、ハイトマップ
C Epiplan-Apochromat 50×/0.95



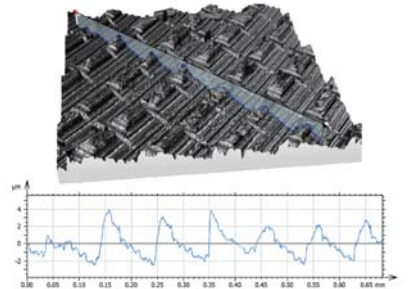
回路基板のプロファイル測定、トゥルーカラーを重ね合わせた3D画像
C Epiplan-Apochromat 10×/0.4



太陽電池表面の銀電極、カラーコード化した高さマップにテクスチャを重ね合わせた3D画像
C Epiplan-Apochromat 50×/0.95



回折光学素子、カラーコード化したハイトマップ
C Epiplan-Apochromat 10×/0.4



圧延アルミニウムの表面、テクスチャを重ね合わせた3D画像
C Epiplan-Apochromat 20×/0.7

レーザー顕微鏡を凌駕する高速撮影をご体感ください！
ショールームで貴社サンプルの解析評価を無料で実施いたします。

無料解析キャンペーン FAXお申し込みフォーム **0120-959-444**

無料解析を希望される方は、下記項目にご記入の上、FAXよりお申し込みください。

会社名/
所属機関名

部署名

役職

氏名

E-mail

TEL

FAX

住所
〒

ご質問がございましたら、お気軽にご記入ください。

カールツァイスマイクロスコーピー株式会社
〒160-0003 東京都新宿区本塩町2番8号
TEL:03-3355-0332

